## 中國海光

第14卷 第1期

# 电子全息术中的两次曝光法

陈建文 傅淑芬 张大可 倪瑞莲 王之江 曹涵清 (中国科学院上海光机所) (宝山钢铁总厂)

提要:以LaBo灯丝为电子束源,Möuenstedt静电双棱镜为电子分束器,在 JEM-200CX 热发射电子显微镜中采用两次曝光法,获得了 MgO 晶体颗粒的 等厚 条纹。

### Double exposure in electron holography

Chen Jianwen, Fu Shufen, Zhang Dake, Ni Ruilian, Wang Zhijiang

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Cao Hanging

(Bao Shan Steel and Iron Works)

Abstract: Contour fringes of MgO crystal grain were obtained by means of double exposure in JEM-200 CX heat emission electron microscope with  $LaB_6$  filament as electron beam source and Möllenstedt electrostatic biprism as electron beam splitter.

一、引言

电子全息术的方法是 Gabor 1948 年提 出的<sup>11</sup>,其目的在于实现物体振幅和位相分 量的完善变换,然后再将振幅和位相分布分 别检测出来,以实现原子尺度的微观探测。

关于电子全息术中的位相检测已经有大量的实验研究报道<sup>[2~4]</sup>。通常的做法是:将 所获得的电子全息图放在如图1所示的光路 中进行再现,即让 M-Z 干涉仪中的两束光, 分别照射全息图,调整 M-Z 干涉仪的两臂, 使再现的共轭波重迭,以达到振幅和位相分 离的目的。若采用非线性方法记录全息图



图1 采用 M-Z 干涉仪检测电子束位相

时,还可以实现高倍率的位相差放大。但是, 由于是共轭波迭加,电子光学系统的象差同 样将被放大。

另一种做法是: 在完全相同的条件下拍 摄同一物体的两张全息图,分别放置在 M-Z

收稿日期: 1986年4月14日。

干涉仪的两个臂中进行再现。这种做法固然 可以消除电子光学系统的象差,但却引进了 再现系统的象差。

我们成功地解决了电子光学系统的各种 漂移,在一张底片上,首次在电子全息技术中 采用光学全息两次曝光方法拍摄了全息图, 用 He-Ne 激光再现,观察到 MgO 单晶的等 厚象。

### 二、电子束位相中包含的信息

电子束的位相与光波的位相在实质上有 很大的差别。这里,我们使用波面的概念进 行考察。电子束的位相 *S*/*h* 为<sup>153</sup>

$$S/h = \frac{1}{h} \int (m\boldsymbol{v} - e\boldsymbol{A}) \cdot d\boldsymbol{s} \qquad (1)$$

其相应的微分形式为:

$$m\boldsymbol{v} - e\boldsymbol{A} = \nabla S \tag{2}$$

式中 h 为普朗克常数, e 和m分别为电子的 电荷和质量, A 为矢势, v 为电子的速度。

(1)式的物理意义是很清楚的:其中第 一项是以德布罗意波长来计算程长求位相, 它是由电场决定的,第二项代表矢势场的影 响。虽然,电子束的位相是由电子所经历地 区的电磁场决定的。因此,在电子束的位相 中包含有电磁场的信息。电子束位相与光波 位相在实质上的这种差别,主要是由于电子 是带电粒子而光子呈电中性所导致的。

### 三、实验方法

系等重经之间的物体履行均同

电子全息首先是在电子显微镜中产生全 息图。由于受电镜结构的限制,电子全息所 采用的光路与光学全息有较大的差别。图2 为制作电子全息常用的工作原理图。其中电 子束源是 JEM-200 CX 热发射型透射式电 子显微镜,电子分束器是 Möuenstedt 静电双 棱镜。为了不对电镜作机械结构上的改动, 双棱镜置于第一中间镜光阑处。图3为带有



双棱镜的插件图。

将待测样品 MgO 单晶置于样品室。MgO 单晶是用烟熏法制取的。由于在电子的轰击 下 MgO 单晶颗粒将会发生强烈振动,故采 用深冷的方法"冻结"物体,以克服这种热扰 动。电子束一半经样品作物束,而另一半不 经样品作参考束。物束和参考束在双棱镜的 作用下重合,产生含有待测物体信息的干涉 条纹。干涉条纹的间距为:

$$\Delta = \frac{\lambda(a+b)}{2a\alpha} \tag{3}$$

式中 λ 为德布罗意波长, a 为等效电子束源 到双棱镜丝的距离, b 为双棱镜丝到干涉平 面的距离, d 为静电双棱镜的偏转角<sup>[6]</sup>:

$$\alpha = \frac{\pi}{2\ln\frac{r_0}{R}} \cdot \frac{V_f}{V_a} \tag{4}$$

式中 ro 为双棱镜丝的半径, R 为双棱镜丝到 地电极的距离, V<sub>1</sub> 为静电双棱镜的工作电 压, V<sub>0</sub> 为电子显微镜的加速电压。

· 25 ·

干涉条纹的总数为:

$$N = \frac{2\ln 3}{k\pi s^2} \cdot \frac{a(a+b)}{b}$$
(5)

式中 8 为电子束源的线度, k 为电子波波矢。 这里要指出的是:为了获得所需的分辨率,必 须使条纹间距小于物体最 细微 结构的 1/3。 因此,正确选择实验参数很有必要。

为了获得一个好的相干电子束源,除第 一聚光镜和第二聚光镜强激励以外,应尽量 采用较小尺寸的光阑。由于采用了象面全息 术,物镜正聚焦,第一中间镜关闭,第二中间 镜和投影镜将样品放大在底片上,这样就获 得了电子全息图。

两次曝光时,一次无样品,底片上记录 的仅是干涉图形。然后将样品送入工作台, 进行第二次曝光。在两次记录期间要保证电 镜工作状态不发生变化。这不仅需要谨慎小 心地操作,而且要防止周围环境被空间杂散 磁场所污染,保证电子束和样品稳定,机械结 构不发生振动,否则将导致实验的失败。

两次曝光时,由于插入样品,使电子束产生的相移为:

$$\frac{\delta\phi(\boldsymbol{x})}{2\pi} = \frac{\delta V(\boldsymbol{x})\rho(\boldsymbol{x})}{2V_{a}\lambda} - \frac{e}{\hbar} \int \boldsymbol{B}(\boldsymbol{x}) \cdot d\boldsymbol{\sigma}$$
(6)

式中  $V_{o}$  是电子的加速电压,  $\delta V$  是被测样品的内电势(通常为 10~30 V),  $\rho$  是样品的厚度, 而  $\int \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$  是待测样品的磁通量。由于MgO 单晶是非磁性材料, 若己知物体的内电势, 那么, 根据(6)式, 通过两次曝光方法, 就可以确定物体的厚度增量;

 $\Delta \rho = \lambda \left(\frac{2V_a}{\Delta V}\right) \tag{7}$ 

### 四、实验结果

电镜的工作电压为 80 kV, 电源电压的 稳定性为 2×10<sup>-6</sup>, 静电双棱镜上施 加的 正

电压为 32 V, 丝直径为 1.77 μm, α=14 cm, b=9 cm, 电镜的标称放大率为 73,000 倍, 曝 光时间 1 分钟。为了减小底片的相干噪声, 采用图 4 所示的再现光路,因此 MgO 单晶 粒子除了在电子显微镜中预放大以外,还可 以在再现光路中进一步被放大,放大率可以 通过物距和象距的变化来调节。



图 4 MgO 晶体等厚图的再现光路

图 5 为用两次曝光法而获得的 MgO 单 晶粒子的等厚图。



1. 本实验采用两次曝光法,测试了 MgO 单晶的等厚图,现在估算一下这种方法的灵 敏度。如方程(7)所表明的,当 4V=10 V, V<sub>a</sub>=80 kV,两条等厚线之间的物体厚度增量 4ρ 为:

$$\Delta \rho = \lambda \left(\frac{2V_s}{AV}\right) \approx 70.0 \,\mathrm{nm} \qquad (8)$$

如果对条纹的偏移估计可以准确到 10%, 那 么厚度测量的不确定量为 Δρ=7 nm。当然, 如果采用较低的加速电压工作,可以提高灵 敏度。若采用位相差放大技术,灵敏度将会 大幅度提高。在光学全息术中,位相差已经 放大到 64 倍,实际上这种技术已被移植到电 子全息术中。

(下转第 30 页)

激光波长约为 8 mm ( $K_0$  波段)。这 与 图 2 给出的理论值 (频率约 44 GHz)符合。图 7 的其他工作参数是:电子束能量 0.5 MeV,束 流 1kA,电子束持续时间 60 ns,空心电子束 截面外径  $\phi$  16 mm,内径  $\phi$  14 mm;漂移管内 径  $\phi$  20 mm,铁环波荡器共 26 个周期,其周 期长 22.5 mm, 全长 585 mm;辐射由增益为



图 7 引导磁场 Bo 对激光输出能量 E 的影响 (条件:上方,空心电子束,下方;实心电子束; 采用铁环波荡器泵浦(周期 22.5 mm))

(上接第26页)

如果采用其他方法能够测出两条等厚线 之间的厚度增量,那么采用上述方法,就可以 测定物体的内电势。

2. 本实验中采用的 MgO 单晶, 其颗粒 的线度约为 80.0nm, 因此在这里讨论分辨 率似乎没有意义。

13dB 的喇叭输出,由 H 面扇形喇叭接收, 经3m长 K。波段标准波导管输入屏蔽房测 试辐射脉冲的频谱及时谱;由炭斗量热器测 试激光能量。

将引导磁场置于最佳值 (9kG)处,获得的较好结果的一组典型值为:能量 13mJ,脉冲半高宽 25ns,平均功率 0.5MW,瞬时电子效率 0.1%,波长约 8mm(K。波段)。

引导磁场线圈是由中国科学院合肥等离 子体研究所施嘉标、潘引年、王伟同志设计绕 制的;此外,本工作是在王之江教授指导下进 行的。作者对他们表示衷心感谢。

#### 参考文献

- [1] 褚 成等; 《中国激光》, 1985, 12, No. 12, 767.
- [2] R. H. Jackson et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1983, QE-19, 346.
- [3] 褚 成等;《中国激光》, 1985, 12, No. 6, 330.
- [4] S. H. Gold et al.; Phys. Rev. Lett., 1984, 52, 1218.
- [5] S. H. Gold et al.; Phys. Fluids, 1984, 27, 746.
- [6] J. A. Pasour et al.; Phys. Rev. Lett., 1984, 53, 1728.

### 参考文献

[1] D. Gabor; Nature(London), 1948, 161, 777.

- [2] H. Wahl; Optik, 1974, 39, 585.
- [3] A. Tonomura, T. Matsuda; Optik, 1979, 53, 143.
- [4] K. J. Hanszen; Electron Microsc. Proc. Eur. Congr. 7th, 1980, Vol. 1, 140.
- [5] 外村彰; 《应用物理》, 1984, 53, No. 8, 664.
- [6] 陈建文; 《光学学报》, 1985, 5, No. 3, 229.